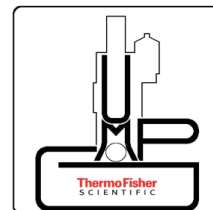


PROGRAMME DU 63^{ème} GUMP à JUSSIEU



Date : 18-20 mars 2020

Lieu : salle de conférence de l'IMPMC, l'Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie, Tour 22,23, 4^{ème} étage, Salle 1

IMPMC, Université Pierre et Marie Curie

Jussieu - Paris 75 005

Mercredi 18 mars

13 : 00 – 14 : 00 : Café d'accueil et enregistrement des participants

14 : 00 – 14 : 30 : Mots d'introduction, Danièle SPEHNER (Vice-présidente du GUMP) et Imène ESTEVE qui nous accueille dans son laboratoire

14 : 30 – 15 : 30 : Marco CANTONI (EPFL, Lausanne) : Introduction générale : le FIB-SEM

15 : 30 – 16 : 15 : Emmanuel BOUZY (Université de Metz) et Frédérique DELABROUILLE (EDF, Moret-sur-Loing): Principes SEM et FIB

16 : 15 – 16 : 45 : Pause – discussion

16 : 45 – 17 : 15 : Jean DARASPE (UNIL, Lausanne) : Préparation pour slice and view pour Helios 550 et alignement des images

17 : 15 – 17 : 45 : Moara LEMOS (Pasteur, Paris) : 3D architecture of flagellum in trypanosomes during development in the tsetse fly

17 : 45 – 18 : 15 : Sylvie MIGOT (Université de Nancy) : Apport du MEB FIB à la préparation des lames minces en science des matériaux

18 : 15 – 18 :45 : Marie-Pierre CHAUVAT (CIMAP, Caen) : TEM Plan-view samples optimization for III-nitride semiconductors devices

Jeudi 19 mars

09 : 00 – 9 : 15 : accueil

09 : 15 – 10 : 15 : Alex RIGORT (Thermo Fisher) : Latest developments in cryo-dual beam sample preparation for tomography

10 : 15 – 10 : 45 : Pause – discussion

10 : 45 – 11 : 15 : Pierre Henri Jouneau (CEA, Grenoble) : Préparation d'échantillons par FMC (FIB micro cleavage)

11 : 15 – 11 : 45 : Daniel MONVILLE (GATAN) : Apport du polissage ionique par faisceau non focalisé d'argon pour la préparation de lames minces post FIB

12 : 00 – 13 : 00 : Pause déjeuner à la Brasserie l'Ardoise, sur le site de Jussieu

13 : 00 – 14 : 00 : **Session : « Une question, une dia »**

***Driss IHHIAWAKRIM (IPCMS, Cronenbourg) : Description morphologique de la porosité multi échelles par différents matériaux : problème de préparation et d'acquisition et comment y remédier**

***Daniel GRANDMAISON (Thermo Fisher) : Solutions logicielles**

***Aurélié DELIOT (Sanofi), Cédric MESSAOUDI (Curie, Orsay) : utilisation des approches de inpainting dans l'amélioration des images FIB-SEM**

* **Philippe BUFFAT (EPFL, Lausanne): According to the Velox user manual delivered with Talos EDS Super-X1**

14 : 00 – 14 : 30 : **Robin SCHAUBLIN (EPFL, Zürich) : Ultrastructure sur les lames FIB...**

14 : 30 – 15 : 00 : **Claudie JOSSE (Centre de Micro-caractérisation R. CASTAING, Toulouse) : Le FIB en science des matériaux : un outil polyvalent**

15 : 00 – 15 : 30 : **Pause – discussion**

15 : 30 – 16 : 30 : **Assemblée Générale**

16 : 30 – 17 : 00 : **Imène ESTEVE (IMPMC Jussieu) : Nouvelles méthodologies de préparation d'échantillons fragiles et/ou hydratés pour des contextes de multi-échelles et techniques corrélatives**

17 : 00 – 17 : 30 : **Danièle SPEHNER (IGBMC, Illkirch) : FIB SEM Tomographie et cryo tomographie en biologie**

18 : 00 départ pour le CIEL DE PARIS

19 : 00 - 21 : 00: **Restaurant le ciel de Paris** à la tour Montparnasse (33 AV. DU MAINE- Tél. : 01.40.64.77.67)

Vendredi 20 mars

08 : 45 – 09 : 00 : **accueil**

09 : 00 – 09 : 30 : **Martiane CABIE (CP2M, Aix-Marseille Université) : Elongation et rupture de nanoparticules d'oxyde lors de l'étirage d'une fibre optique : caractérisation 3D par tomographie FIB/SEM.**

09 : 30 – 10 : 00 : **Eva HERIPRE (MSSMat, Centrale Supélec, CNRS, Université Saclay): le MEB-FIB, un outil pour l'usinage de micro-échantillons**

10 : 00 – 10 : 20 : **Pause – discussion**

10 : 20 – 10 : 50 : **Anna PROKHODTSEVA (Thermo Fisher) : Different approach for TEM sample preparation in Material science : solutions for in situ TEM sample preparation**

10 : 50 – 11 : 20 : **Rémi MERCIER (EDF Chinon) : Méthode de préparation de lame mince pour l'étude au MET de défauts d'irradiations dans des matériaux métalliques**

11 : 20 – 11 : 50 : Horalid PHELIPPEAU (Thermo Fisher) : Image Processing And Quantification for Electron Microscopy

11 : 30 – le mot de la fin